

114 年半導體 AI 製程檢測尖端技術教師實務研習課程

課程時間：114 年 8 月 11 日（一）至 8 月 12 日（二）

課程地點：財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心
（新竹市東區展業一路 26 號）

課程人數：30 人

參與對象：全國各大專校院、高中職在職教師

報名網址：<https://forms.gle/8PnspgomNaWpYLWS8>

報名 QR Code：



課程內容

日期	時間	課程內容	授課講師
8/11 (一)	08:45~09:00	報到	
	09:00~10:00	1.半導體研究中心介紹 2.材料分析簡介	財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心 林昆霖副主任
	10:00~12:00	原子尖相關檢測技術介紹(APT、AFM…)	財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心 周棟煥工程師、簡依玲工程師 楊雨宸工程師
	12:00 ~ 13:30	午餐	
	13:30 ~ 14:30	光譜檢測技術介紹 (FTIR、Raman…)	財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心 楊忠諺博士
	14:30~18:00	微觀繞射相關檢測技術介紹 (TEM、SEM、XRD、FIB、Nanoindenter…)	財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心 吳建霆博士、許瓊姿工程師 黃怡晶博士、許建中博士
8/12 (二)	08:45 ~ 09:00	報到	
	09:00 ~ 12:00	表面分析相關檢測技術介紹 (XPS、SIMS、DHEM…)	財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心 余東元博士、黃玉麟工程師 張家和工程師
	12:00 ~ 13:30	午餐	
	13:30~17:30	材料儀器設備見習 (分 4 組 4 位講師帶)	財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心 吳建霆博士、余東原博士 周棟煥工程師、楊忠諺博士
	17:30~18:00	產學交流&總結	財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心 林昆霖副主任